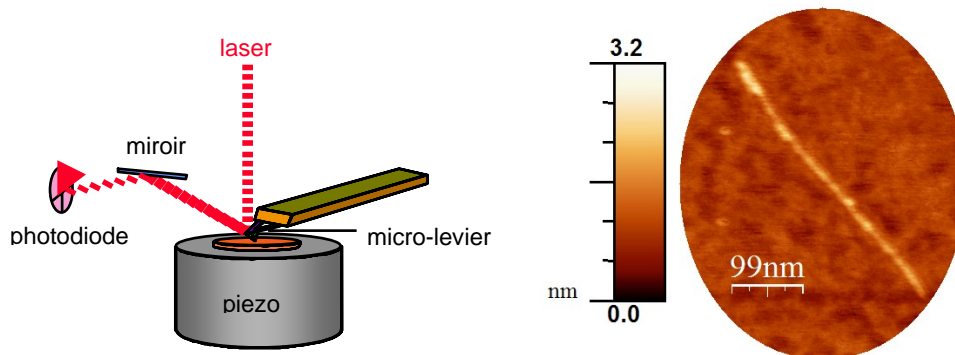


ATELIER n°4 : *La matière à l'échelle du nanomètre (2) (AFM)*

Le **microscope à force atomique** (AFM) est un outil de caractérisation des surfaces à l'échelle du nanomètre. Le principe du microscope à force atomique s'appuie sur les forces d'interaction atomiques entre une pointe et la surface de l'échantillon à étudier, avec ou sans contact. La pointe, qui balaye la surface de l'échantillon, est reliée à un levier flexible dont les déviations, sous l'effet des interactions pointe-surface, sont analysées par un ordinateur qui fournit alors une image de la surface.

L'AFM peut être utilisé dans tous les environnements possibles : ultra-vide, air, liquide et pour tout type d'échantillon : isolants, conducteurs, métalliques.



Principe de l'AFM et image AFM d'un complexe NTC/ADN déposé sur mica.